

TÊTE GONIOMÉTRIQUE EUCENTRIQUE POUR DIFFRACTION DE RAYONS X, ENRAF-NONIUS

FICHE N° 4257

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

Période de fabrication : 1950-1974

Fabricant : ENRAF-NONIUS

Domaines : Chimie, Physique

Sous-domaines : Cristallographie, Chimie du solide, Cristallographie

Organisme : Université de Rennes

Ville : Rennes

Modèle : Y914 ACA eucentrique

Matériaux : Acier inoxydable, Métal

Description

Les têtes goniométriques encore appelées « support goniométrique » sont des petites pièces métalliques qui permettent de régler avec précision la position des échantillons à étudier par diffraction des rayons X. Généralement sous forme de cristaux, ces échantillons sont positionnés au sommet d'une tige de verre, puis placés dans le faisceau de rayons X. On étudie alors les figures ou les tâches de diffraction et on en déduit la symétrie et la structure du matériau étudié. La tête goniométrique permet généralement de nombreux réglages :

- Déplacement horizontal et vertical (dit xyz) de l'échantillon que l'on va placer dans le faisceau de rayons X.
- Rotation à l'aide de deux berceaux métalliques indépendants qui permet de régler les axes des cristaux par rapport au faisceau selon la demande. Ce réglage peut être effectué au degré près grâce à une petite clé construite spécialement et livrée avec la tête. Ici la rotation des berceaux est possible entre + et - 20 degrés.

Utilisation

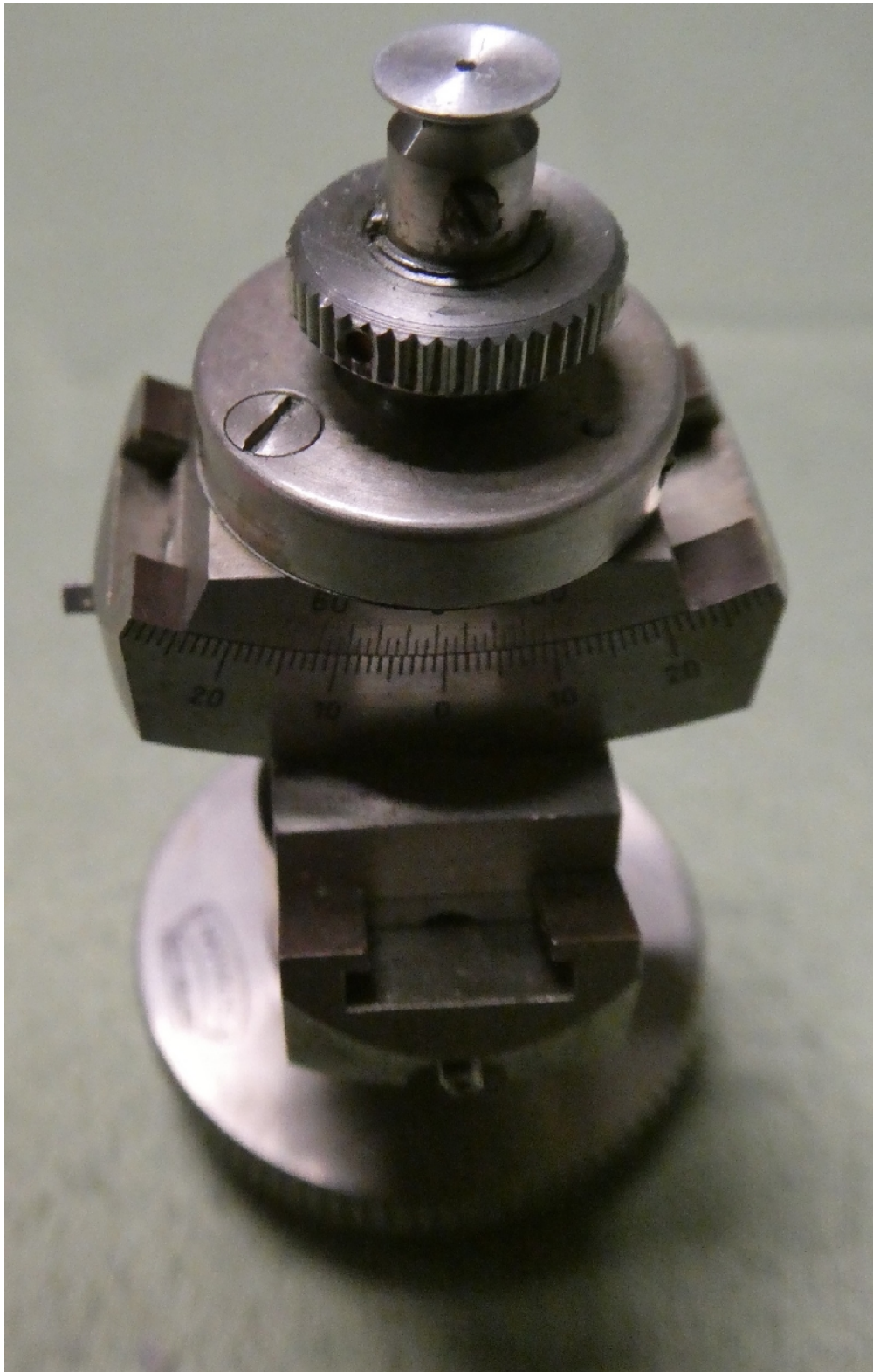
Cette tête goniométrique (modèle Y914 ACA eucentrique), conservée au sein des collections de la faculté des sciences de Rennes a été diffusée par la société Enraf-Nonius. Elle était utilisée pour de nombreux types d'expériences mais en particulier pour les diffractomètres mais aussi sur toutes les chambres à monocristaux de type Weissenberg, de Précession et les Rétigraphes (voir les fiches correspondantes à ces différentes chambres).











Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Tête goniométrique eucentrique pour diffraction de rayons X, Enraf-Nonius (ENRAF-NONIUS), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=16275>, consulté le 2026-07-28